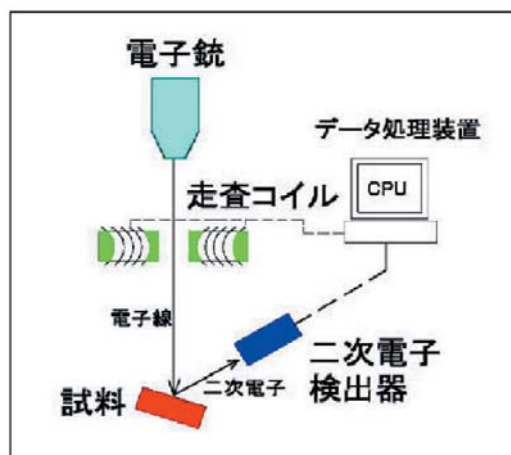


走査型電子顕微鏡

Scanning Electron Microscope (SEM)

日立製作所製 S-4800



フィールド・エミッション型電子銃で、物質に電子線を走査しながら照射し、発生する二次電子を検出し、物質表面の像観察を行う

1. 機器名称 走査型電子顕微鏡
2. 機器分類 形態観察
3. 担当部署 理工学部 ナノ物質工学科
4. 装置担当 森本 万里子
5. 導入年度 2004年
6. 型式 日立製作所 S-4800
7. 仕様・性能 倍率;800,000倍、電子銃;電界放射型(加速電圧;0.5~30kV)、検出器;二次電子検出・反射電子検出、分解能;1nm
8. 機器の開放状況(該当する区分を選択して下さい。)
 - ・ 研究指導条件下で、有料で開放している。(3,990円/1時間、210円/1写真)
注：試料作成の真空蒸着装置使用量は620円/1時間です。
 - ・ **共同研究利用の場合は無料**
9. 利用上の注意点
10. 主な使用事例：金属、高分子材料などの微細表面化観察